連続ミューオンビーム施設 MuSIC による新学術の展開

佐藤 朗、友野 大、川島 祥孝 基礎理学プロジェクト研究センター・サブアトミック科学研究拠点

日本で唯一の連続時間構造を持つミューオンビームを提供するミューオン施設 RCNP-MuSIC が大阪大学で稼働中です。吹田キャンパスにある核物理研究センター (RCNP) のサイクロトロン加速器を使用して生成する高性能の連続状ミューオンビームを使って、様々な新しい基礎科学研究・応用研究の展開が始まっています。

ミューオンは、電子と同じレプトンと呼ばれる素粒子の一種です。ミューオンの質量は 106 メガ電子ボルトで、これは電子の 200 倍、水素の 1/9 倍の質量に相当します。 従って、ミューオンが物質内に入ると、負電荷のミューオンは重い電子のように振い、正電荷のミューオンは軽い水素のように振る舞います。

例えば、負電荷ミューオンは、電子と同様に正電荷を持つ原子核を中心に周回します。しかし、このとき周回するミューオンの軌道半径は電子に比べて質量比の分だけ、つまり、約 1/200 小さくなります。よって、内側の軌道へと遷移する際に放出される特性 X 線のエネルギーも電子特性 X 線に比べて約 200 倍高いエネルギーとなります。この高エネルギーのミューオン特性 X 線を測定することにより、物質の内部 1cm 程度までの元素組成や同位体比情報を完全に非破壊で調べることが出来ます。実際に、古代青銅器や隕石などの破壊できない貴重資料の分析が MuSIC のミューオンビームを使って進められています。また、負電荷ミューオンが原子核の原子番号を1つだけ小さくするという性質もあります。例えば、水銀に負電荷ミューオンを照射すると金に変換できるのです。これを応用して、原発使用済み燃料中に含まれる 600 万年以上も放射線を出し続ける元素をミューオンにより無害化する研究(ミューオン核変換)も進められています。

一方、ミューオンによる高温超伝導素材の研究も始まりました。正電荷ミューオンの崩壊で発生した陽電子はスピン方向に出やすいという性質があります。この特徴を利用すると、陽電子放出方向の時間変化の測定により、物質が内部に持つ局所磁場の情報を得ることが出来ます。連続ミューオンビームは高い磁場にも感度があるため、超伝導など磁性体の研究を進めることが可能です。

RCNP-MuSIC は 2016 年度より共同利用施設として世界の研究者にミューオンビームの提供を開始しました。すでに 1 6 実験課題が実施されています。その内容は、原子核研究だけでなく、惑星科学、放射化学、考古学、文化財科学、エネルギー問題、半導体ソフトエラーなど幅広く、新しい応用分野がさらに広がりつつあります。今後、さらに最新の測定技術を駆使して、ミューオンを使った科学技術の新しい時代を推進して行く計画です。

参考文献:http://www.rcnp.osaka-u.ac.jp/RCNPhome/music/

CANDLES 検出器を用いた二重ベータ崩壊の研究

核物理研究センター 梅原さおり、他 CANDLES グループ 連携研究部門サブアトミック科学研究拠点 (二重ベータ崩壊測定 CANDLES グループ)

「ニュートリノを放出しない二重ベータ崩壊(以下、 $0\nu\beta\beta$ 崩壊)」は、基礎物理学において極めて重要な研究である。それは、 $0\nu\beta\beta$ 崩壊の研究が、素粒子ニュートリノの本質に迫り、物質の起源解明に関わるからである。我々が開発する CANDLES 検出器は、 48 Ca 同位体を用いた二重ベータ崩壊測定装置である。

この 0ν β β 崩壊は、半減期が 10^{26} 年以上と非常に極稀な事象であるため、ごく低バックグラウンド検出器を構築する必要がある。我々は、宇宙線起源バックグラウンドの少ない岐阜県神岡地下実験室において、300kg の CaF_2 結晶を用いたプロトタイプ CANDLESIII 検出器で二重ベータ崩壊測定を行っている。

[1]伊賀友輝、2020年日本物理学会、発表予定



図1: CaF₂モジュール。CaF₂結晶から放出される紫外光を可視光に変換するために、波長変換剤に入れる。CANDLESの光センサーは、CaF₂モジュールからの可視光を検出する。モジュール作成作業は、放射性不純物を取り込まないために、クリーン環境で行った。



図 1: CANDLES 検出器の CaF_2 結晶の放射性不純物量分布。14 個は新しい結晶。青プロットは、これまでのデータ、赤プロットは、入れ替えた後のデータを示す。入れ替えた 14 個の結晶のみ、放射性不純物量が減っていることが分かる。

研究業績リスト

I 査読論文

該当なし

Ⅱ 国際会議等における発表

該当なし

Ⅲ 国内会議等における発表

該当なし

Ⅳ 著書

該当なし

Ⅴ 受賞と知的財産

該当なし

VI その他研究業績、発表文献

該当なし